

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ H01L 21/66	(11) 공개번호 특 1995-0015689	(43) 공개일자 1995년 06월 17일
(21) 출원번호	특 1993-0024223	
(22) 출원일자	1993년 11월 15일	
(71) 출원인	대우전자 주식회사 배순훈	
(72) 발명자	서울특별시 중구 남대문로 5가 541번지 김진호	
(74) 대리인	서울특별시 도봉구 수유 3동 29-19 최종왕	

심사청구 : 있음

(54) 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치

요약

본 발명은 트랜지스터의 임펄스 파괴특성 측정장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 트랜지스터의 콜렉터측에 각기 다른 레벨의 전류값을 인가시킨 후 트랜지스터의 파괴 여부를 검출할 수 있도록 한 트랜지스터의 임펄스 파괴특성 측정장치에 관한 것이다.

즉 본 발명은 제1도에서와 같이 정전류 전원장치(30)의 전류값을 선택하여 피측정용 트랜지스터(Q)의 콜렉터측에 인가시키며, 상기 피측정용 트랜지스터(Q)의 파괴여부를 검출하는 제어 및 처리장치(10)와, 상기 정전류 전원장치(30)의 선택 전류값과 피측정 트랜지스터(Q)의 파괴여부를 표시하는 표시장치(20)로 구성된 것이다.

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]
트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치
[도면의 간단한 설명]
제1도는 본 발명에 따른 회로도.
제2도는 본 발명에 따른 흐름도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

정전류 전원장치(30)의 전류값을 선택하여 피측정용 트랜지스터(Q)의 콜렉터측에 인가시키며, 상기 피측정용 트랜지스터(Q)의 파괴여부를 검출하는 제어 및 처리장치(10)와, 상기 정전류 전원장치(30)의 선택 전류값과 피측정 트랜지스터(Q)의 파괴여부를 표시하는 표시장치(20)로 구성함을 특징으로 하는 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 제어 및 처리장치(10)의 제어로 정전류 전원장치(30)의 전류 출력을 단속하는 임펄스 전류 단속부(40)가 구성되어진 특징을 갖는 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치.

청구항 3

제2항에 있어서, 정전류 전원장치(30)의 전류 출력시간(T)을 임의로 선택하도록 구성함을 특징으로 하는 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치.

청구항 4

제2항에서 있어서, 임펄스 전류 단속부(40)는 상호 연동하는 트랜지스터(Q₂)(Q₁)로 구성되어짐을 특징으로 하는 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치.

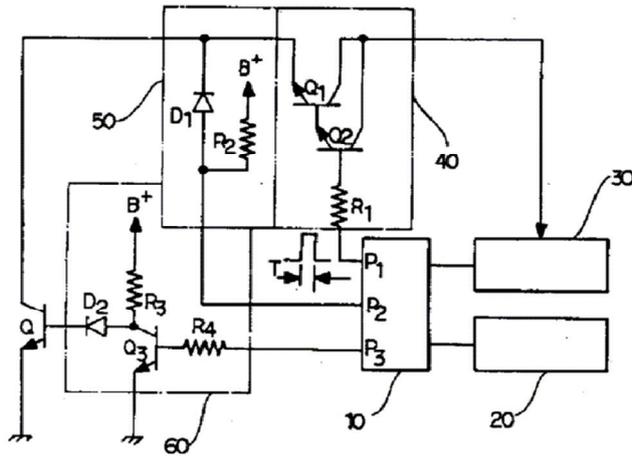
청구항 5

제1항에 있어서, 제어 및 처리장치(10)의 제어데이터를 피측정 트랜지스터(Q)의 베이스측에 인가시키는 버퍼부(60)와, 제어 및 처리장치(10)의 제어로 피측정 트랜지스터(Q)의 콜렉터측에 풀업전원을 인가시키는 풀업전원부(50)를 구성시켜 피측정 트랜지스터(Q)의 파괴여부를 검출함을 특징으로 하는 트랜지스터 임펄스 파괴특성 측정장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2

